



# FST 5000

## FILM STRESS TESTER

### 薄膜应力测量仪

Based on classic Stoney formula principle, advanced laser technology and smart operation make the FST5000 film stress tester particularly suitable for measurement in fast characterization of wafer bow, warpage, profile, and residual stress.

基于经典基片弯曲法Stoney公式测量原理，采用先进的激光扫描方式和探测技术，以及智能化的操作，使得FST5000薄膜应力仪特别适合于晶圆类光电薄膜样品的弓高、翘曲、轮廓形貌、曲率半径和薄膜应力测量和计算。



Dual wavelength Scanning!

双波长扫描!

Automatic Measurement!

全自动测量!

High Cost-effective !

高性价比!

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan ,

Shenzhen, China

[Http://www.suproinst.com](http://www.suproinst.com)

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

Email: [sales@suproinst.com](mailto:sales@suproinst.com)

规格	参数
基本原理	激光曲率法 基于Stoney公式
主要方法	采用双波长激光对样品进行扫描测量 635 nm/670 nm 波长/ >5mW
主要功能	自动测量晶圆样品轮廓形貌、弓高、翘曲度、曲率半径和薄膜应力
薄膜应力测试范围	1- 10000 MPa
曲率半径测试范围	2- 20000 m
曲率半径重复精度	<1 % @1 $\sigma$ (曲率半径 < 20 m) <2.5 % @1 $\sigma$ (曲率半径 < 200 m)
扫描最小步长	0.1 mm
样品尺寸	子型号M6-标配最大6英寸, 向下兼容4、3、2英寸 子型号M8-标配最大8英寸, 向下兼容6、4、2英寸 子型号M12-标配最大12英寸, 向下兼容8、6、4英寸
样品台	电动旋转平台
样品基片校正	可数据处理校正原始表面不平影响 (对减模式)
电源	110-220 VAC & 200 Watts Maximum
通讯连接端口	USB 3.0
工作温度	室温
操作软件	可视化2D/3D显示晶圆轮廓形貌、弓高、翘曲 曲率半径和薄膜应力分布 视窗界面/适用于Windows 10系统
操作电脑	标配品牌台式一体机: 显示器: $\geq 21$ 英寸, $\geq 8$ G内存, CPU $\geq 2.5$ GHz, $\geq 512$ G硬盘
外形尺寸	~850 宽 $\times$ 550深 $\times$ 450 高 mm
重量	~ 35 K g
质量保证	一年免费/终身维护
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205

邮件: sales@suproinst.com

Http://www.suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司 (北京办事处)

地址: 北京市房山区长阳镇熙悦广场4号楼307-309室

电话: 010-63839091 传真: 010-63839091

邮件: zkchang@suproinst.com